

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分  
 【発行日】平成31年1月31日 (2019.1.31)

【公開番号】特開2018-119991(P2018-119991A)  
 【公開日】平成30年8月2日 (2018.8.2)  
 【年通号数】公開・登録公報2018-029  
 【出願番号】特願2018-90906(P2018-90906)  
 【国際特許分類】

G 0 1 B 9/02 (2006.01)

G 0 1 B 11/00 (2006.01)

G 0 1 J 9/02 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 B 9/02

G 0 1 B 11/00 G

G 0 1 J 9/02

【手続補正書】  
 【提出日】平成30年12月14日 (2018.12.14)  
 【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

前記装置は、前記測定ビームと前記少なくとも部分的に反射された測定ビームとのビーム経路において物体と第 1 の検出器との間に配置された第 1 のレンズユニットを含み、前記レンズユニットの開口数は 0 . 1 以上であることを特徴とする請求項 1 に記載の光干渉測定装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 5】

前記第 1 の検出器によってヘテロダイン測定が行われるように構成され、その際、周波数シフトが、測定ビームとすべての参照ビームの間の周波数シフトを行うように設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の光干渉測定装置。